

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】令和3年5月20日(2021.5.20)

【公開番号】特開2020-153724(P2020-153724A)

【公開日】令和2年9月24日(2020.9.24)

【年通号数】公開・登録公報2020-039

【出願番号】特願2019-50689(P2019-50689)

【国際特許分類】

G 01 N 23/20008 (2018.01)

G 01 N 23/207 (2018.01)

G 01 N 23/201 (2018.01)

【F I】

G 01 N 23/20008

G 01 N 23/207

G 01 N 23/201

【手続補正書】

【提出日】令和3年4月6日(2021.4.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1の方向に延伸する入射側アームと固定部と受側アームとを備えるゴニオメータと、前記入射側アームに配置され、前記第1の方向に交差する第2の方向に延伸するX線ビームを発生させるX線源と、

前記固定部に配置され、試料を支持する支持台と、

前記固定部に配置され、前記X線源より発生する前記X線ビームの前記第2の方向に沿う線幅を制限する平行スリットと、

前記受側アームに配置され、前記試料より発生する散乱X線を検出する検出器と、を備える、X線分析装置。

【請求項2】

請求項1に記載のX線分析装置であって、

前記平行スリットを前記第2の方向に移動させる移動機構を備える、

ことを特徴とする、X線分析装置。

【請求項3】

請求項1又は2に記載のX線分析装置であって、

前記平行スリットは、中空円の一部となる形状を有する、

ことを特徴とする、X線分析装置。